

ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СПЛАВА V_3Si

Л. Т. Колдаева, Г. П. Мотулович, А. А. Шубин

УДК 537.312.62; 535.393

Измерены оптические постоянные сплава V_3Si . Получены его микрохарактеристики.

Измерение оптических постоянных металлов и сплавов позволяет определить их электронные характеристики /1/. В настоящей работе выполнены измерения комплексного показателя преломления сплава V_3Si в интервале длин волн $3\text{--}10 \mu\text{м}$, что позволило определить его электронные характеристики. Специальный интерес к этому связан с его высокими критическими сверхпроводящими параметрами. Этот сплав обладает наиболее высокой температурой сверхпроводящего перехода среди всех сплавов на основе ванадия. Электронные характеристики V_3Si до настоящего времени не были определены.

I. Экспериментальная часть.

В работе исследовались пленки V_3Si . Способ изготовления образцов основывался на испарении в вакууме электронным пучком заранее приготовленного сплава ванадий-кремний и осаждении его на полированные рубиновые подложки. Данный способ оказался возможным из-за сравнительно близких температур испарения ванадия и кремния. Напыление проводилось в вакууме ($1\text{--}5)10^{-5}$ мм рт.ст. Температура подложки $T_{II} = 1100^\circ\text{C}$. Одновременно с основным образом, предназначенным для оптических исследований, производилось напыление ряда образцов для измерения сверхпроводящих и других параметров. Характеристики образцов: толщина слоя $d = 0,3 \mu\text{м}$, постоянная решетки $a = 4,720 \text{\AA}$ *) статическая проводимость $\sigma = 0,69 \cdot 10^{16} \text{ сек}^{-1}$, $R_{\text{комн}}/R_{\text{ост}} = 6,97$ ($R_{\text{комн}}$ и $R_{\text{ост}}$ соответ-

*) Постоянная решетки была определена по дебаеграмме Н. Н. Лобановым.

ветственно сопротивления при комнатной температуре и при температуре непосредственно перед сверхпроводящим переходом), температура перехода в сверхпроводящее состояние $T_c = 16,65^\circ\text{K}$, ширина перехода в сверхпроводящее состояние $\Delta T_c = 0,85^\circ\text{K}$.

Измерение оптических постоянных осуществлялось поляризационным методом на установке, описанной в работе /2/. Установка рассчитана на четырехкратное отражение от исследуемых зеркал. Как оказалось, пленки V_3Si относительно плохо (по сравнению с другими металлами) отражают компоненту света, поляризованную перпендикулярно плоскости падения. После четырехкратного отражения света при углах падения $\varphi \sim 70 \pm 80^\circ$ интенсивность указанной компоненты была мала, что существенно снижало точность измерения. Для повышения точности мы использовали три эталонных золотых зеркала и одно зеркало V_3Si . Предварительно на той же установке измерились оптические постоянные эталонных зеркал. Было выполнено пять серий измерений четырех эталонных зеркал и пять серий измерений зеркала V_3Si с тремя эталонными зеркалами.

II. Результаты измерений и их обсуждение.

Результаты измерений комплексного показателя преломления $n - ix$ сплава V_3Si приведены на рисунке I, где указана также ошибка измерений. Сглаженные данные приводятся в таблице I.

Таблица I

$\lambda, \text{ мкм}$	n	x	$\lambda, \text{ мкм}$	n	x
3,00	3,32	5,89	6,00	5,80	10,5
3,23	3,80	6,45	6,50	6,30	II, I
3,50	3,85	6,86	7,00	6,78	II, 7
3,76	3,96	7,25	7,50	6,96	II, I
4,00	4,01	7,57	8,00	6,90	II, 5
4,24	4,09	7,87	8,50	7,28	II, 8
4,50	4,26	8,30	9,00	7,92	II, 2
4,75	4,40	8,39	9,50	8,65	II, 6
5,00	4,70	9,07	10,00	9,29	II, 9
5,50	5,24	9,79			

Как будет ясно из дальнейшего, для изучаемого сплава при комнатной температуре осуществляется нормальный скрин-эффект. Поэтому в спектральной области, где влиянием межзонных переходов можно пренебречь, связь концентрации N электронов проводимости и их

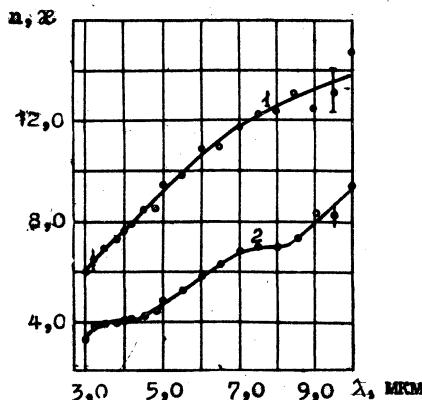


Рис. I. Зависимость ζ (1) и n (2) сплава V_3Si от λ

эффективной частоты соударений $\bar{\nu}$ с оптическими постоянными дается формулами /I/:

$$N = 0,1115(1+z^2-n^2)[1+4n^2z^2/(1+z^2-n^2)] \cdot 10^{22}/\lambda^2 \text{ см}^{-3}, \quad (I)$$

$$\bar{\nu} = \left\{ 37,68n^2/[1 + z^2 - n^2]/\lambda \right\} 10^{14} \text{ сек}^{-1}.$$

Здесь λ — длина волн света в мкм. Анализ полученных результатов (рис. I и табл. I) показывает, что V_3Si имеет слабые полосы межзонных переходов в спектральных областях около 3 и 6+7 мкм. Поэтому формулы (I) использовались нами в интервале длин волн 8+10 мкм. Средние значения N и $\bar{\nu}$ в указанном интервале приведены в таблице 2. При дополнительных измерениях в коротковолновой области возможно полное разделение вкладов в комплексную диэлектрическую проницаемость электронов проводимости и всех существенных полос межзонных переходов и дальнейшее уточнение N и $\bar{\nu}$.

Таблица 2

Характеристика	v_{Si}	v	v_{Ga}	Nb_{Sn}
$N, 10^{22} \text{ см}^{-3}$	0,71	2,00	2,2	1,2
N/N_a	0,094	0,27	0,33	0,23
$N/N_{\text{вал}}$	0,020	0,055	0,07	0,05
η	4,75	5	4,5	4,75
$v_F, 10^8 \text{ см сек}^{-1}$	0,36	0,6	0,65	0,49
v_F/v_F°	0,14	0,23	0,27	0,22
$S_F, 10^{-37} \text{ г}^2 \text{ см}^2 \text{ сек}^{-2}$	0,95	1,9	1,6	1,2
S_F/S_F°	0,14	0,23	0,27	0,22
$E_F^\circ, \text{ эв}$	18,5	-	16,6	14,6
$\nu, 10^{14} \text{ сек}^{-1}$	4,0	3,0	8,6	2,9
$\nu_{\text{кл}}, 10^{14} \text{ сек}^{-1}$	2,2	0,99	2,2	1,4
$\nu_{\text{ед}}, 10^{14} \text{ сек}^{-1}$	0,37	-	3,3	0,9
$l, 10^{-6} \text{ см}$	0,09	0,2	0,08	0,17
$\delta, 10^{-6} \text{ см}$	8,7	5	7,5	7,7
$T, ^\circ\text{К}$	16,65	4,9	13,7	17,6
$\lambda_{\text{епн}}$	0,90	0,41	0,92	0,58

Микрохарактеристики v_{Si} даны в таблице 2, где для сравнения приводятся соответствующие данные для v /3/, v_{Ga} /4/ и Nb_{Sn} /5/. Здесь N_a - концентрация атомов; $N_{\text{вал}}$ - концентрация валентных электронов; η - валентность; v_F - средняя скорость электронов на поверхности Ферми; S_F - полная площадь поверхности Ферми; E_F° - энергия Ферми. Верхний индекс \circ указывает, что соответствующая величина относится к свободным электронам при концентрации, равной валентной; $\nu_{\text{кл}}$ - классическая частота соударений электронов с фононами, $\nu_{\text{ед}}$ - частота соударений с примесями и дефектами решетки; l - длина свободного пробега; δ - глубина скин-слоя; $\lambda_{\text{епн}}$ - константа электрон-фононного взаимодействия. При вычислении v_F и S_F мы использовали формулы работы /1/. Вычисление $\lambda_{\text{епн}}$ проводилось по формуле работы /6/.

Как видно из таблицы, $1 \ll \delta$, что указывает на нормальный характер скин-эффекта.

Сплав V_3Si имеет наименьшие среди приведенных в таблице значения электронных характеристик N , N/N_a , $N/N_{\text{вал}}$, v_F и S_F . Существенно отметить, что при малом значении N сплав V_3Si обладает высоким T_c . Сравнение V_3Si с V_3Ga показывает, что увеличение N приводит к снижению T_c . Сравнение всех трех сплавов с решеткой Al5 показывает, что зависимость T_c от N немонотонная, а имеет максимум. Немонотонная зависимость отмечалась ранее в работе //7/. Все это указывает на то, что не все электроны проводимости одинаково полезны для явления сверхпроводимости. Мы полагаем, что наиболее существенны для сверхпроводимости электроны, состояния которых в импульсном пространстве описываются точками, близкими к брэгговским плоскостям.

Величины $\bar{\nu}_{ep}^{KL}$ для V_3Si и V_3Ga близки между собой и больше соответствующих величин для V и Nb_3Sn . Это указывает на то, что взаимодействие электронов проводимости с решеткой в V_3Si и V_3Ga примерно одинаково и больше, чем у V и Nb_3Sn .

В заключение выражаем благодарность Н. Н. Лобанову за проведение рентгеноструктурного анализа наших образцов.

Поступила в редакцию
7 декабря 1976 г.

Л и т е р а т у р а

1. Г. П. Мотулевич, УФН, 97, 2II (1969); Труды ФИАН, 55, 3 (1971).
2. Г. П. Мотулевич, А. А. Шубин, Опт. и спектроскопия, II, 633 (1957).
3. И. Д. Маш, Труды ФИАН, 82, 3 (1975).
4. А. И. Головашкин, И. С. Левченко, Г. П. Мотулевич, ЖЭТФ, 57, 74 (1969); Препринт ФИАН, № 44, 1969 г.
5. А. И. Головашкин, Е. Д. Доннер, И. С. Левченко, Г. П. Мотулевич, ЖЭТФ, 59, 1967 (1970); Препринт ФИАН, № 6, 1971 г.
6. Е. Г. Максимов, Г. П. Мотулевич, ЖЭТФ, 61, 414 (1971).
7. А. И. Головашкин, Г. П. Мотулевич, ФТТ, 13, 1232 (1971).